

10/507204

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2004年7月29日 (29.07.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/064106 A1(51) 国際特許分類⁷: H01J 35/30, 35/14

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/000120

(22) 国際出願日: 2004年1月9日 (09.01.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2003-004674 2003年1月10日 (10.01.2003) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 東芝電子管デバイス株式会社 (TOSHIBA ELECTRON TUBE & DEVICES CO., LTD.) [JP/JP]; 〒3248550 栃木県大田原市下石上1385番地 Tochigi (JP). 株式会社東芝 (KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA) [JP/JP]; 〒1058001 東京都港区芝浦一丁目1番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 下野 隆 (SHIMONO, Takashi) [JP/JP]. 清水 克則 (SHIMIZU, Katsunori) [JP/JP].

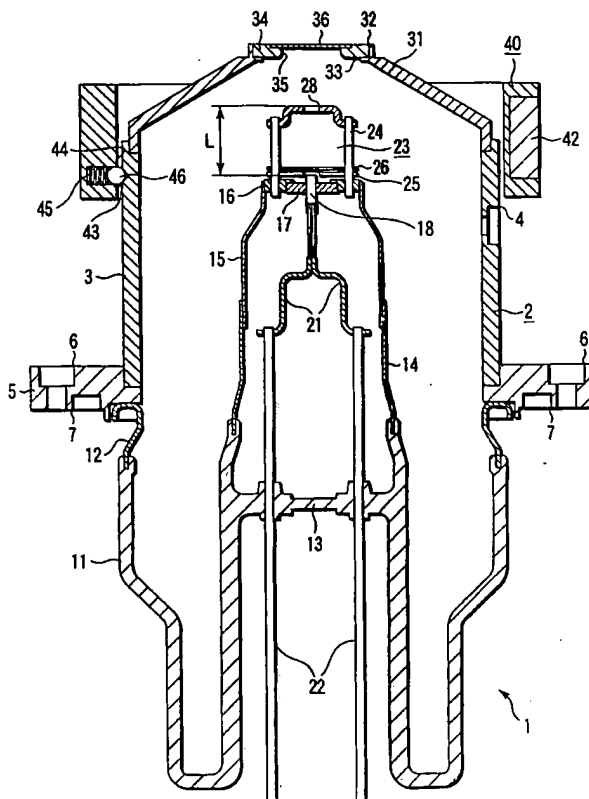
(74) 代理人: 鈴江 武彦, 外(SUZUYE, Takehiko et al.); 〒1000013 東京都千代田区霞が関3丁目7番2号 鈴榮特許綜合法律事務所内 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]

(54) Title: X-RAY EQUIPMENT

(54) 発明の名称: X線装置



(57) Abstract: In an X-ray bulb (1), an electron beam emitted from a cathode (18) impinges against a target (36) to generate X-rays. During operation of the X-ray bulb (1), a magnet section (40) is rotated at a constant time interval and positioned at a specified rotational position. A magnetic field being formed by a permanent magnet (42) is varied by rotation of the magnet section (40) and the position on the target (36) being irradiated with the electron beam is shifted. Consequently, a new position on the target (36) is irradiated with the electron beam thus generating a quantity of X-rays equivalent to that of initial performance.

(57) 要約: X線管球(1)は、陰極(18)から照射した電子ビームをターゲット(36)に衝突させてX線を射出する。X線管球(1)の動作時には、一定時間毎に磁石部(40)を回転させ、所定の回転位置に位置決めする。磁石部(40)の回転により、永久磁石(42)により形成される磁界が変化し、電子ビームのターゲット(36)上の照射位置が移動する。これにより、ターゲット(36)上の新しい位置に電子ビームが照射され、初期性能と等しいX線量が発生する。

004/064106 A1